S	ear	ch i	No	tes



Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/519,454	ARAKAWA ET AL.
Examiner	Art Unit
Hung V. Ngo	2831

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
174	35R	5/18/2006	HVN
	35ms		
430	321		
422	006		
		,	•
			·

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
	-		
	<u>L</u>		

S (INCLUDIN	EARCH NO	TES STRATEGY))
<u> </u>	·:	DATE	EXMR
Text Search		5/18/2006	HVN
	• .		
	•		
	. · : · .		
	; · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	•		
	.•		
	; ;		
	· ·	·	
	:		
	·		
		1	